

2026 年 6 月 3 日

各 位

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社

代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和

所 在 地 京都府向日市ニデックパーク 33 番地 C 棟

JPCA Show 2026 出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2026 年 6 月 10 日(水)～6 月 12 日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第 55 回国際電子回路産業展（JPCA Show 2026）」に出展します。



今回の展示会では、バックドリル向け X 線検査ソリューション、及びニデックグループのシナジーによって新たに誕生した自動搬送機「EFEM(Equipment Front End Module)」をメインで展示いたします。また、市場のトレンドである光モジュールや大型基板に対応した次世代 AI 外観検査装置「AURCA Series」も展示いたします。

既存の画像検査装置および電気検査装置もさらなる高精度化を遂げており、最先端製品の品質要求に応えるトータル検査ソリューションをご提案いたします。

〈出展概要〉

- ・会 期：2026 年 6 月 10 日(水)～6 月 12 日(金)
- ・会 場：東京ビッグサイト 東展示棟
- ・ブ ー ス：東 1-3 ホール 3F-33
- ・公式サイト：<https://www.jpccashow.com/show2026/>

〈出展内容〉

- ・TGV（Through Glass Via）向け高精度検査ソリューション
- ・バックドリル向け高速 CT 型 X 線検査機
- ・Equipment Front End Module フルパネルサイズ対応自動搬送機
- ・大型個片半導体パッケージ向け高精度検査装置
- ・半導体パッケージ多面付けフルパネル基板検査装置
- ・大型/多ピン基板向け導通絶縁検査装置
- ・光モジュール・大型基板対応次世代 AI 外観検査装置
- ・高密度基板対応 2D/3D 検査装置
- ・狭ピッチ対応プローブ
- ・パワー半導体 ダイ/デバイス検査システム
- ・・・EFEM Series
- ・・・GATS[®]-7837
- ・・・GATS[®]-8370
- ・・・STAR REC[®] V6
- ・・・AURCA Series
- ・・・RSH Series
- ・・・NS プローブ
- ・・・NATS[®] Series